

G 01 R 31/28

Ans.nr.: 1705/85

Indleveret: 16 apr 1985

Løbedag: 16 apr 1985

Alm. tilgængelig: 17 okt 1985

Prioritet: 16 apr 1984 GB 8409794

29 mar 1985 GB 8508319

*MARS INCORPORATED; McLean, US.

Opfinder: John William *Bailey; GB, Paul Alan

*Hayter; GB, Brian Robert *Mason; GB, Graham Norman *Turner; GB.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree

Afprøvningsapparat

S A M M E N D R A G.

1705-85

Et i-kredsløbstestapparat (fabrikationsfejlanalysator) til bestemmelse af fabrikationsfejl i en elektrisk kredsløbsplade, såsom kortslutninger, banefejl, fejlindsatte, udeladte og udenfor tolerance liggende komponenter osv., og ikke til udførelse af fuld funktionsafprøvning af kredsløbspladen, omfatter et system af toretningsstrømledende analoge skiftenetværk (31-34), der hvert fastlægger et testpunkt (37) for forbindelse til et knudepunkt i en kredsløbsplade, og som under programmelstyring af det respektive skiftenetværk kan forbindes enten med en stimuluskilde (terminal 35) eller med et reference-(f.eks. jord-) potential (terminal 36) og samtidigt også med en indgang (38,39) på en måleanordning. En modstand, kondensator, induktans eller anden kredsløbskomponent kan forbindes mellem testpunkterne (37) tilvejebragt af to af skiftenetværkene og kan således udsættes for en passende stimulus, og dens svar måles og analyseres for bestemmelse af levedygtigheden af den respektive komponent. En modificeret form af apparatet muliggør, at forstærkningen af diskrete transistorer også overvåges. En bordmodel af apparatet har et rum i sit hovedhus til optagelse af et udskifteligt pladeaffølingsmodul, som er kundeudformet til en bestemt plade, som skal afprøves, og har et

kundeudformet sondesystem, der er koblet til den ene del af en universal sammenkoblingskonnektor, hvis anden del er anbragt i rummet i hovedhuset, således at de to dele føres sammen, når modulet indsættes i rummet i huset.

1705-85

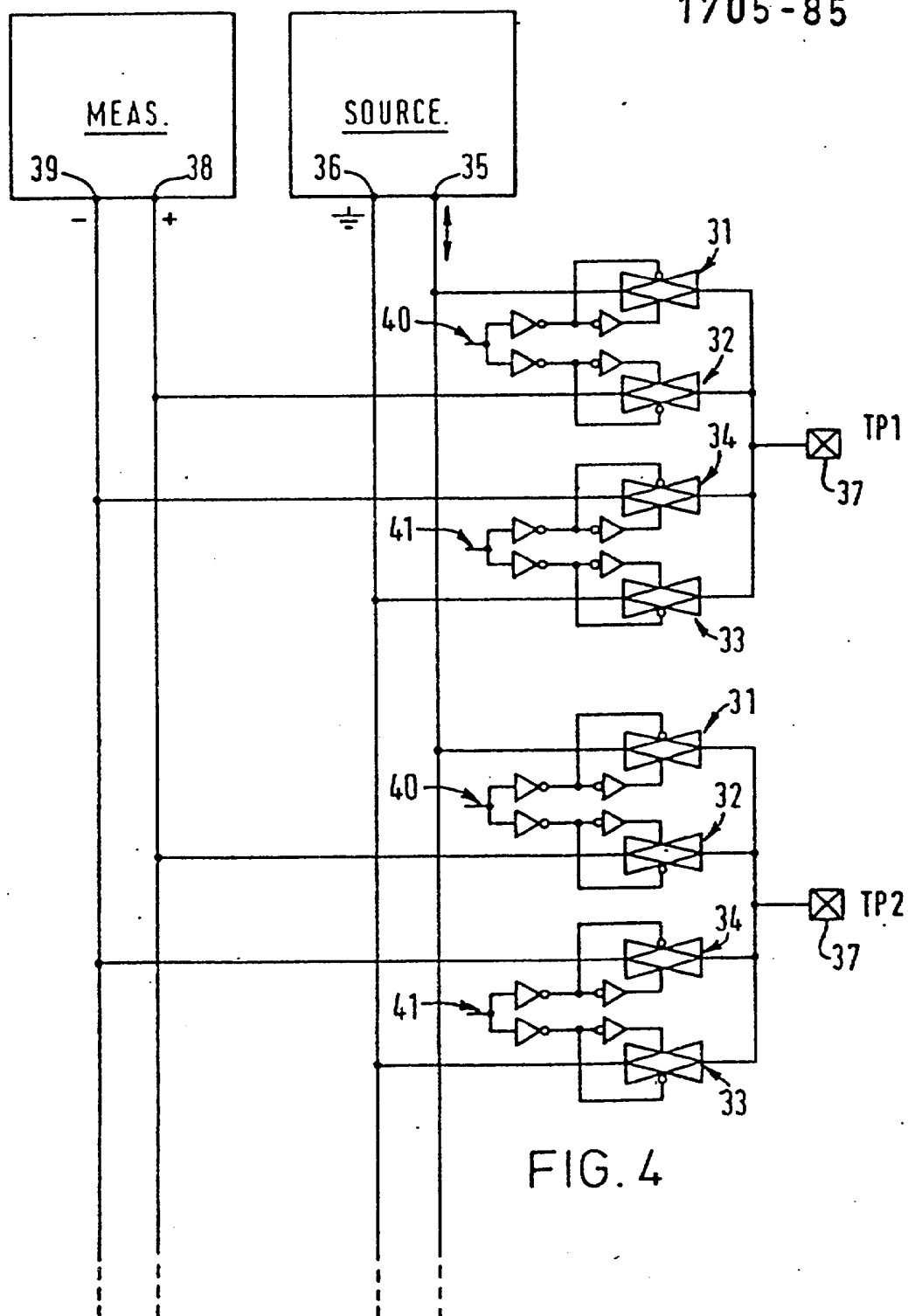


FIG. 4